

有機EL発光層の成分分析

雰囲気を保ったまま解体・前処理から装置導入まで可能

測定法 : TOF-SIMS・雰囲気制御下での処理

製品分野 : ディスプレイ

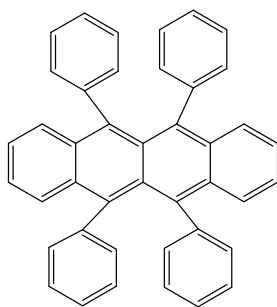
分析目的 : 組成評価・同定

概要

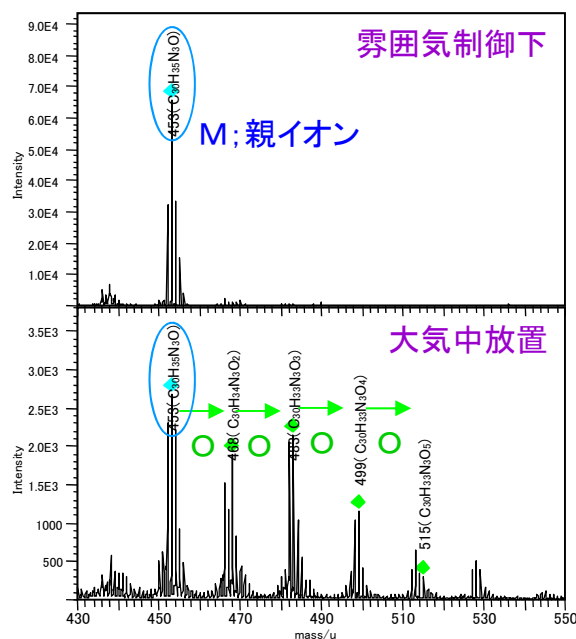
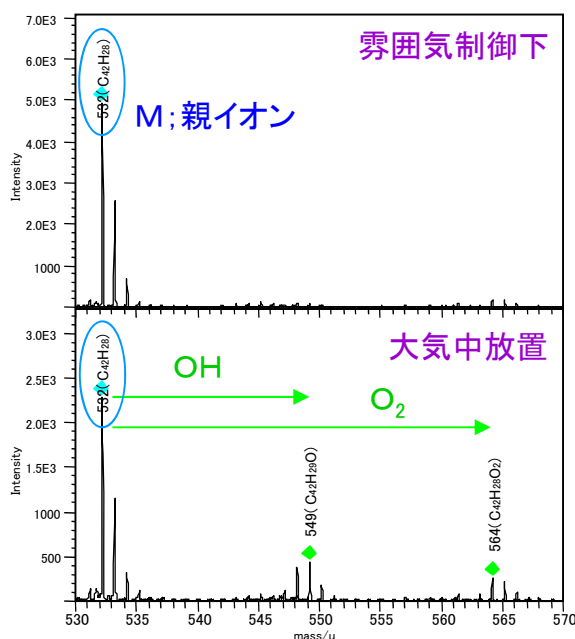
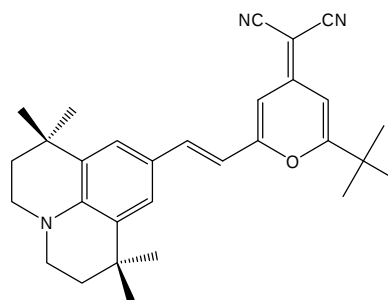
有機EL材料は空気に触れると変質することが知られています。雰囲気制御下と大気中に放置した発光材料表面についてTOF-SIMSから得られた結果を紹介します。雰囲気制御下で作製したサンプルでは親イオンが主として検出されますが、空気に放置すると親イオンに酸素がついたフラグメントが検出されています。変質しやすい原料については大気にさらさず分析することが必要です。

データ

■ルブレン赤色ゲスト



■DCJTBA赤色ゲスト



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>